

DELPHION

No acti

**RESEARCH****PRODUCTS****INSIDE DELPHION****Log Out** **Work Files** **Saved Searches**

My Account

Search: Quick/Number Boolean Advanced

Derwent RecordView: [Expand Details](#) Go to: [Delphion Integrated View](#)

Tools: Add to Work File: Create new

Derwent Title: **Semiconductor thin film prodn. - by cleaving from wafer along micro-bubble layer formed by ion implantation**

Original Title: **EP0763849A1: Process for preparing thin semiconductor films**

Assignee: **COMMISSARIAT ENERGIE ATOMIQUE** Standard company
Other publications from **COMMISSARIAT ENERGIE ATOMIQUE (COMS)...**

Inventor: **BRUEL M;**

Accession/Update: **1997-167983 / 200428**

IPC Code: **H01L 21/20 ; H01L 21/265 ; H01L 21/324 ; C30B 31/22 ; H01L 21/762 ;**

Derwent Classes: **L03; U11;**

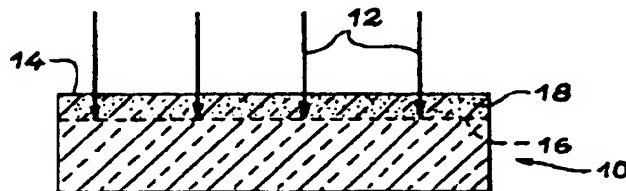
Manual Codes: **L04-C02B**(Semiconductor processing - doping by ion injection) , **L04-C16**(Heat treatment of semiconductors) , **U11-C01J1**(Epitaxial growth of semiconductor layer) , **U11-C08A3**(Dielectric, polycrystalline silicon trench for isolating IC components)

Derwent Abstract: ([EP0763849A](#)) A semiconductor thin film prodn. process involves (a) ion implantation (12) across a semiconductor wafer face (14), which is parallel to a crystallographic plane of the semiconductor, in order to form a cleavage layer (16) of gaseous micro-bubbles which delimits a surface layer (18) in the wafer (10); and (b) wafer heat treatment to cause separation of the surface layer (18) from the rest of the wafer along the micro-bubble layer by the effects of crystalline rearrangement and pressure in the micro-bubbles. The novelty is that the implantation energy is such that the ion penetration depth is greater than a minimum depth required to obtain a thin film of the surface layer which is sufficiently rigid for release by the heat treatment. Pref. the wafer is of silicon or silicon carbide and the minimum depth is 5 microns or 1.15 microns respectively.

Use - Esp. for prodn. of single crystal semiconductor thin films useful in microelectronics e.g. to form SOI substrates, membranes, masks (e.g. for x-ray lithography) and ICs with several active layers.

Advantage - The process is simple, allows use of relatively low energies and produces a thin film which has sufficient rigidity to eliminate the need for a stiffener and which has homogeneous and controlled thickness.

Images:



Dwg.1/4

Family:

PDF Patent

Pub. Date

Derwent
Update

Pages Language IPC Code

☒ **EP0763849A1** * 1997-03-19 199716 9 French H01L 21/20
 Des. States: (R) BE DE FR GB IT NL
 Local appls.: EP1996000401932 Filed:1996-09-10 (96EP-0401932)

 KR0400684B = 2004-01-14 200428 English H01L 21/265
 Local appls.: Previous Publ. KR97018021 (KR 97018021)
 KR1996000038442 Filed:1996-09-05 (96KR-0038442)

☒ **DE69617147E** = 2002-01-03 200210 German H01L 21/20
 Local appls.: Based on EP00763849 (EP 763849)
EP1996000401932 Filed:1996-09-10 (96EP-0401932)
DE1996000617147 Filed:1996-09-10 (96DE-0617147)

☒ **EP0763849B1** = 2001-11-21 200176 9 French H01L 21/20
 Des. States: (R) BE DE FR GB IT NL
 Local appls.: EP1996000401932 Filed:1996-09-10 (96EP-0401932)

☒ **US5714395** = 1998-02-03 199812 5 English H01L 21/265
 Local appls.: US1996000713201 Filed:1996-09-12 (96US-0713201)

☒ **JP09181011A** = 1997-07-11 199738 6 English H01L 21/265
 Local appls.: JP1996000233428 Filed:1996-09-03 (96JP-0233428)

 KR97018021A = 1997-04-30 199819 English H01L 21/265
 Local appls.: KR1996000038442 Filed:1996-09-05 (96KR-0038442)

☒ **FR2738671A1** = 1997-03-14 199720 16 French H01L 21/324
 Local appls.: FR1995000010718 Filed:1995-09-13 (95FR-0010718)

INPADOC
 Legal Status:

First Claim:
Show all claims

Show legal status actions

1. Procédé de fabrication d'un film mince à matériau semi-conducteur, comportant les étapes suivantes :

- - l'implantation d'ions (12) à travers une face (14) d'une plaquette (10) de matériau semi-conducteur, cette face étant sensiblement parallèle à un plan cristallographique du semi-conducteur, pour créer dans la plaquette une couche de clivage, de microbulles gazeuses (16), qui délimite dans la plaquette (10) une couche superficielle (18),
- - le traitement thermique de la plaquette à une température apte à provoquer, par un effet de réarrangement cristallin et un effet de pression dans les microbulles gazeuses (16) une séparation de la couche superficielle (18) d'avec le reste de la plaquette, selon la couche de microbulles, caractérisé en ce que l'on effectue l'implantation à une énergie telle que la profondeur de pénétration des ions soit supérieure à une profondeur minimum déterminée pour obtenir un film mince, comportant ladite couche superficielle, qui soit suffisamment rigide pour que le traitement thermique puisse le libérer.

Priority Number

(19)



Europäisches Patentamt
European Patent Office
Office européen des brevets



(11)

EP 0 763 849 A1

(12)

DEMANDE DE BREVET EUROPEEN

(43) Date de publication:
19.03.1997 Bulletin 1997/12

(51) Int Cl.⁶: H01L 21/20, H01L 21/762

(21) Numéro de dépôt: 96401932.7

(22) Date de dépôt: 10.09.1996

(84) Etats contractants désignés:
BE DE FR GB IT NL

(72) Inventeur: Bruel, Michel
38113 Veurey (FR)

(30) Priorité: 13.09.1995 FR 9510718

(74) Mandataire: Dubois-Chabert, Guy et al
c/o BREVATOME
25, rue de Ponthieu
75008 Paris (FR)

(71) Demandeur: COMMISSARIAT A L'ENERGIE
ATOMIQUE
75015 Paris (FR)

(54) Procédé de fabrication de films minces à matériau semi-conducteur

(57) Procédé de fabrication d'un film mince à matériau semi-conducteur.

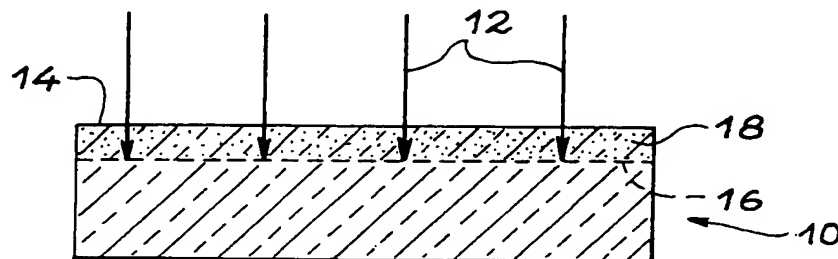
Le procédé comporte les étapes suivantes :

- l'implantation d'ions (12) dans une plaquette semi-conductrice (10), pour y créer une couche de clivage, de microbulles gazeuses (16),
- le traitement thermique de la plaquette apte à pro-

voquer une séparation d'une couche superficielle (18) d'avec le reste de la plaquette, selon la couche de microbulles.

Selon l'invention, on effectue l'implantation à une profondeur supérieure ou égale à une profondeur minimum déterminée, pour que le film mince obtenu soit rigide, et pour que le traitement thermique puisse le libérer.

FIG. 1



EP 0 763 849 A1

présente description. Ce procédé, très avantageux, permet de s'affranchir des contraintes des autres procédés déjà mentionnés, telles que la nécessité d'utiliser un substrat initial de nature différente de celle du semi-conducteur choisi, la nécessité de très fortes doses d'implantation, la nécessité d'une barrière d'arrêt de gravure, etc.

Une limitation importante de ce procédé tient cependant au fait que le film mince ne peut être obtenu que par l'utilisation d'un raidisseur qui lui confère une rigidité suffisante.

Ainsi, un but de la présente invention est de proposer un procédé de fabrication d'un film mince qui présente des caractéristiques de rigidité suffisantes pour s'affranchir de l'utilisation d'un raidisseur.

Un autre but est également de proposer un procédé qui permette d'obtenir des films avec une épaisseur homogène et contrôlée.

Un but est aussi de proposer un procédé simple qu'il soit possible de mettre en oeuvre avec des énergies relativement basses.

Exposé de l'invention

Pour atteindre ces buts, l'objet de la présente invention est un procédé de fabrication d'un film mince à matériau semi-conducteur, comportant les étapes suivantes :

- implantation d'ions à travers une face d'une plaquette de matériau semi-conducteur, cette face étant sensiblement parallèle à un plan cristallographique du semi-conducteur, pour créer dans la plaquette une couche de clivage de microbulles gazeuses, qui délimite dans la plaquette une couche superficielle,
- traitement thermique de la plaquette à une température apte à provoquer, par un effet de réarrangement cristallin et un effet de pression dans les microbulles gazeuses, une séparation de la couche superficielle d'avec le reste de la plaquette, selon la couche de microbulles, caractérisé en ce qu'on effectue l'implantation à une énergie telle que la profondeur de pénétration des ions soit supérieure ou égale à une profondeur minimum déterminée, pour obtenir un film mince comportant ladite couche superficielle, qui soit suffisamment rigide pour que le traitement thermique puisse le libérer.

Au sens de la présente invention, on entend par "microbulle gazeuse" toute cavité ou microcavité générée par l'implantation d'ions de gaz d'hydrogène ou de gaz rares dans le matériau. Les cavités peuvent se présenter sous une forme très aplatie, c'est-à-dire de faible hauteur, par exemple quelques distances inter atomiques aussi bien que sous forme sensiblement sphérique et toute autre forme différente de ces deux formes précédentes. Ces cavités peuvent contenir une phase gazeuse libre et/ou des atomes de gaz issus des ions implantés fixés sur des atomes du matériau formant les parois des cavités. Ces cavités sont généralement appelées en terminologie anglo-saxonne "platelet", "microblister" ou même "bubbles".

Par ailleurs, on entend par film mince rigide un film dont les propriétés mécaniques sont suffisantes pour éviter que l'application de la deuxième étape se traduise par l'apparition de gonflements, de bulles et d'éclatements de bulles, et donc pour que l'application de la deuxième étape se traduise par un décollement sur toute la surface. Ainsi, on entend par libération du film mince, le décollement complet du film. Ce film obtenu selon le procédé de l'invention est autoporté, c'est-à-dire indépendant mécaniquement et peut être utilisé directement.

La plaquette de matériau semi-conducteur peut être monocristalline ou polycristalline.

On considère par ailleurs que la couche de microbulles gazeuses est une couche de clivage lorsque l'implantation est effectuée à une dose telle que le clivage provoqué lors du traitement thermique, conduise à la séparation totale sur toute la surface du film mince. La profondeur minimum qui dépend du type de matériau utilisé pour réaliser le film mince, correspond à aussi l'épaisseur minimale qu'aura ce film.

Selon un mode de mise en oeuvre particulièrement avantageux de l'invention, il est possible de former, sur la face libre de la plaquette, avant l'étape d'implantation, au moins une couche, dite de rigidité, en un matériau ayant une rigidité supérieure à la rigidité du matériau de la plaquette, la couche présentant une épaisseur telle, et l'implantation étant effectuée à une énergie telle que la couche de rigidité puisse être traversée par les ions. La couche superficielle et la couche de rigidité forment alors le film mince.

Le film mince est alors un film multicouches qui comporte la couche superficielle et la ou les couche(s) du film de rigidité. La profondeur de pénétration minimum de l'implantation est toujours telle que l'épaisseur du film mince, c'est-à-dire de l'ensemble de ces couches aient les caractéristiques de rigidité recherchées.

Pour réaliser la couche de rigidité, on peut choisir préférentiellement des matériaux constitués d'atomes légers, c'est-à-dire de numéro atomique faible, par exemple inférieur ou égal à 14, pour lesquels le pouvoir de freinage des ions implantés est faible.

Il apparaît de façon surprenante qu'il est possible de mettre en oeuvre le procédé de l'invention avec des énergies relativement faibles. Un choix judicieux des matériaux permet d'envisager le procédé avec des énergies d'implantation inférieures à 200 keV.

D'autres caractéristiques et avantages de la présente invention ressortiront de la description qui va suivre, en référence aux dessins annexés, donnée à titre purement illustratif et non limitatif.

Brève description des figures

La figure 1 montre de façon schématique une implantation d'ions dans une plaquette de matériau semi-conducteur conformément à une première étape du procédé de l'invention.

La figure 2 montre de façon schématique la formation d'un film mince par séparation d'une couche supérieure de la plaquette conformément à une deuxième étape de l'invention.

La figure 3 montre l'étape d'implantation d'ions dans une plaquette selon une mise en oeuvre perfectionnée de la présente invention.

La figure 4 montre la séparation d'un film mince multicouche de la plaquette selon la mise en oeuvre perfectionnée de l'invention.

Description de modes de mise en oeuvre de l'invention

Comme le montre la figure 1, qui correspond à une première mise en oeuvre de l'invention, le procédé comporte tout d'abord une implantation d'ions dans une plaquette ou un lingot 10 de matériau semi-conducteur monocristallin ou polycristallin.

L'implantation est repérée avec des flèches qui portent la référence 12. Elle est effectuée à travers une face supérieure 14 de la plaquette 10 qui est sensiblement parallèle à un plan cristallographique principal du substrat, tel qu'un plan (1, 0, 0) par exemple. Les ions implantés sont des ions de gaz rare ou de gaz hydrogène.

L'implantation permet de former dans le volume de la plaquette, à une profondeur voisine de la profondeur moyenne de pénétration des ions, une couche de microbulles gazeuses 16. Cette couche de microbulles délimite dans la plaquette 10 une couche superficielle 18 destinée à former le film mince.

A ce sujet, la description du procédé objet du document (5) est considérée comme incluse dans la présente description à titre d'information.

On peut noter en particulier que pendant l'implantation des ions, la plaquette est préférentiellement maintenue à une température inférieure à la température à laquelle les atomes du gaz implanté peuvent s'échapper du semi-conducteur par diffusion.

Conformément à l'invention, l'implantation est effectuée à une énergie telle que la profondeur de pénétration soit supérieure ou égale à une profondeur minimum pour que le film soit rigide. Pour atteindre au moins cette profondeur minimum, l'énergie d'implantation doit donc être supérieure à une énergie seuil qui correspond à une pénétration des ions à la profondeur minimum.

La profondeur et l'énergie de l'implantation sont liées. Pour un type d'ion implanté donné, elles sont déterminées pour l'essentiel par la nature du matériau semi-conducteur utilisé.

A titre d'exemple, le tableau I, ci-après, donne une correspondance entre l'épaisseur d'un film que l'on souhaite réaliser et l'énergie d'implantation requise, dans le cas particulier de l'implantation d'ions hydrogène dans du silicium.

Tableau I

Epaisseur	5 μm	10 μm	30 μm	100 μm
Energie	500 keV	750 keV	1500 keV	3200 keV

Le tableau II, ci-après, donne, à titre d'exemple, successivement la profondeur minimum d'implantation requise pour que le film soit rigide, la dose d'implantation minimum dans le cas où les ions sont des ions d'hydrogène, et l'énergie minimum d'implantation pour deux matériaux semi-conducteurs (Si et SiC) particulièrement bien adaptés à la mise en oeuvre de l'invention.

Tableau II

	Silicium	SiC
Profondeur Minimum	5 μm	1,15 μm
Dose Hydrogène minimum	510 ¹⁶ cm ⁻²	210 ¹⁷ cm ⁻²
Energie minimum Hydrogène	500 keV	180 keV

La figure 2 montre l'opération de clivage. Le substrat 10 subit un traitement thermique à une température supérieure

à la température à laquelle est réalisé le bombardement ionique, et suffisante pour créer, par un effet de réarrangement cristallin dans la plaquette 10, et de pression dans les microbulles 16 (fig. 1), une séparation de la couche superficielle 18, de la partie massive 20 du substrat.

La couche superficielle 18 constitue alors le film mince libre.

La température du traitement thermique est de l'ordre de 500°C dans le cas où le matériau semi-conducteur utilisée est du silicium.

Une autre mise en oeuvre de l'invention, qui en constitue un perfectionnement, est représentée aux figures 3 et 4. Les parties des figures 3 et 4 identiques ou similaires à celles des figures 1 et 2 portent les mêmes références et on pourra se reporter à leur sujet, à la partie de la description qui précède.

Comme le montre la figure 3, on recouvre la face 14 du substrat 10 avec une couche de rigidité 22. Cette couche est réalisée en un matériau qui présente préférentiellement une rigidité supérieure à la rigidité du matériau semi-conducteur du substrat. Elle est en outre réalisée avant l'implantation d'ions 12.

Il est possible de former sur le substrat 10, une seule, mais aussi une pluralité de telles couches de rigidité. Celle (s)-ci est(sont) par exemple formée(s) par des techniques de dépôt chimique en phase vapeur activé par plasma (PECVD) ou à basse pression (LPCVD), ou par pulvérisation ou évaporation sous vide, ou tout simplement collée(s) sur la face 14 par des traitements de surface appropriés permettant après mise en contact l'établissement de liaisons interatomiques.

Dans l'exemple de la figure 3, une seule couche de rigidité est formée.

Il s'agit de préférence d'une couche en un matériau constitué d'atomes légers dont le pouvoir de freinage des ions implantés est faible. Le diamant ($Z=6$) et le carbure de silicium ($Z(C)=6$, $Z(Si)=14$) sont des matériaux que l'on sait déposer en couches, qui sont aisément traversables par les ions tels que les ions hydrogènes, et qui présentent d'excellentes propriétés mécaniques. Ces matériaux conviennent donc particulièrement pour la mise en oeuvre de l'invention. Ils sont déposés selon des méthodes connues par exemple de dépôt PECVD (Plasma Enhanced Chemical Vapor Deposition) ou LPCVD (Low Pressure Chemical Vapor Deposition).

Lorsque le substrat 10 est équipé de la couche de rigidité, il est soumis à un bombardement d'ions 12, par exemple d'ions hydrogène, afin d'y former une couche de microbulles gazeuses 16. Cette couche de microbulles permet de délimiter dans le substrat 10 une couche superficielle 18. L'énergie de l'implantation est choisie de telle sorte que les ions traversent la couche de rigidité 14 et pénètrent dans le matériau semi-conducteur. La profondeur de l'implantation qui doit donc être supérieure à l'épaisseur de la (ou des) couche(s) de rigidité, est toujours choisie de sorte que le film mince, c'est-à-dire de l'ensemble formé de la couche supérieure 18 et de la couche de rigidité 22, ait une rigidité suffisante.

Lorsque la couche de rigidité confère par elle-même au film mince une rigidité satisfaisante, l'épaisseur de la couche supérieure 18 formée dans le substrat 10 peut être choisie librement.

Le tableau III ci-après donne à titre indicatif l'épaisseur de la couche de rigidité qu'il convient de former sur la face 14 pour obtenir un film mince rigide. Le tableau III concerne des couches de rigidité en diamant et en carbure de silicium (SiC). Le tableau indique également les énergies d'implantation nécessaires pour des ions d'hydrogène afin que ceux-ci traversent les couches de rigidité.

Tableau III

MATERIAU RIGIDE	DIAMANT	SIC
Epaisseur	1 μm	1,25 μm
Energie H+	≥ 200 keV	≥ 200 keV

Après l'implantation, le substrat subit un traitement thermique qui, comme le montre la figure 4 permet de libérer du substrat 10 le film mince qui comprend la couche superficielle 18 et la couche de rigidité 22.

Documents cités dans la présente description

(1) 1986, IEEE SOS/SOI Technology Workshop, Sept. 30-Oct. 2, 1986, South seas plantation resort and yacht Harbour Captiva Island, Floride.

(2) SIMOX SOI for Integrated Circuit Fabrication par Hon Wai Lam, IEEE Circuits and Devices Magazine, Juillet 1987.

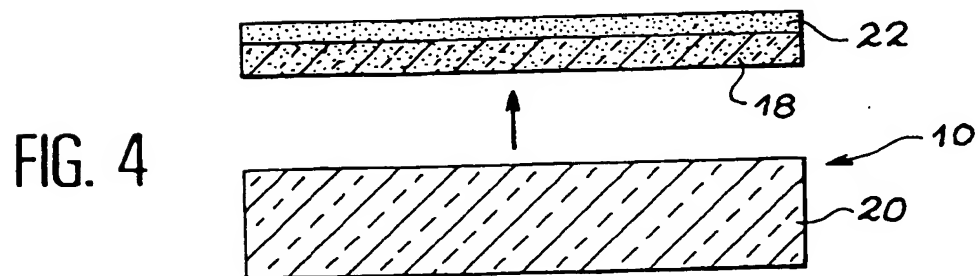
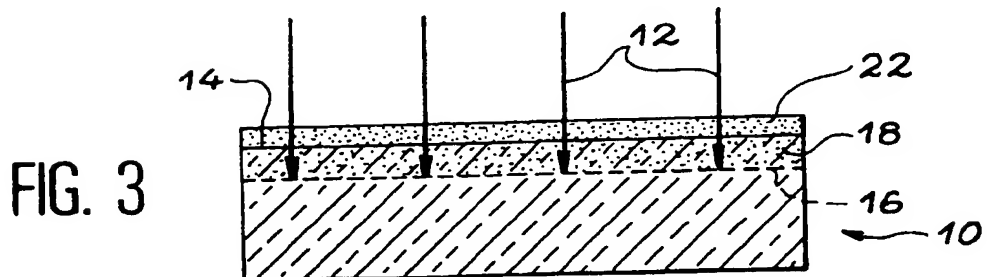
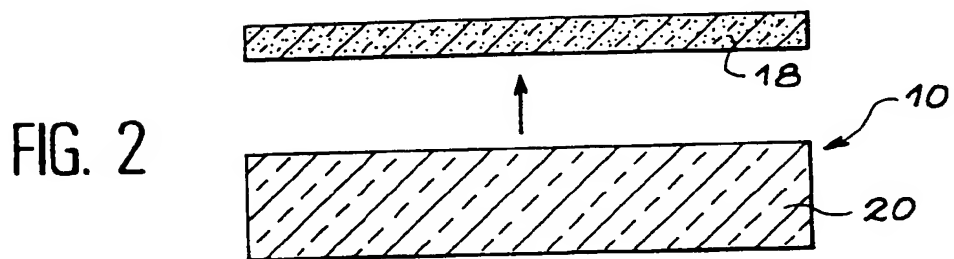
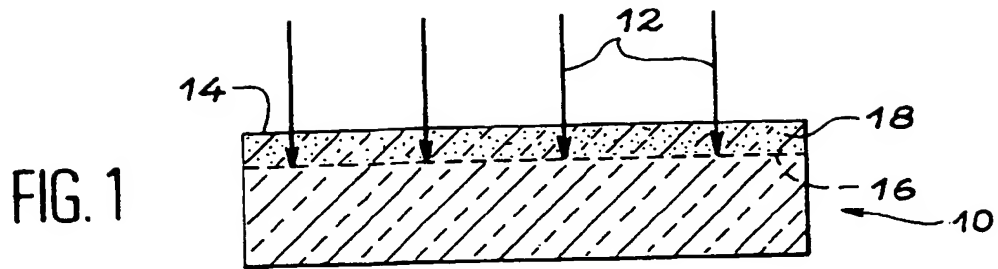
(3) Silicon on Insulator Wafer Bonding Wafer Thinning Technological Evaluations par Haisma, Spierings, Biermann et Pals, Japanese Journal of Applied Physics, vol. 28, n°8, Août 1989.

(4) Bonding of silicon wafers for silicon on insulator, par Maszra, Goetz, Caviglia et McKitterick, Journal of Applied Physic 64 (10), 15 Nov. 1988.

(5) FR-A-2 681 472.

Revendications

1. Procédé de fabrication d'un film mince à matériau semi-conducteur, comportant les étapes suivantes :
 - l'implantation d'ions (12) à travers une face (14) d'une plaquette (10) de matériau semi-conducteur, cette face étant sensiblement parallèle à un plan cristallographique du semi-conducteur, pour créer dans la plaquette une couche de clivage, de microbulles gazeuses (16), qui délimite dans la plaquette (10) une couche superficielle (18),
 - le traitement thermique de la plaquette à une température apte à provoquer, par un effet de réarrangement cristallin et un effet de pression dans les microbulles gazeuses (16) une séparation de la couche superficielle (18) d'avec le reste de la plaquette, selon la couche de microbulles, caractérisé en ce que l'on effectue l'implantation à une énergie telle que la profondeur de pénétration des ions soit supérieure à une profondeur minimum déterminée pour obtenir un film mince, comportant ladite couche superficielle, qui soit suffisamment rigide pour que le traitement thermique puisse le libérer.
2. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce qu'avant l'étape d'implantation d'ions, on forme sur ladite face (14) de la plaquette au moins une couche (22) dite de rigidité en un matériau ayant une rigidité supérieure à la rigidité du matériau de la plaquette (10), la couche présentant une épaisseur telle, et l'implantation étant effectuée à une énergie telle, que la couche de rigidité puisse être traversée par les ions, la couche superficielle et la couche de rigidité formant alors le film mince.
3. Procédé selon la revendication 2, caractérisé en ce que pour former la couche de rigidité (22), on choisit un matériau avec un numéro atomique Z tel que $Z \leq 14$.
4. Procédé selon l'une quelconque des revendications 2 et 3, caractérisé en ce qu'on forme la couche de rigidité (22) selon une technique de dépôt chimique en phase vapeur.
5. Procédé selon l'une quelconque des revendications 2 à 4, caractérisé en ce qu'on rend la couche de rigidité (22) solidaire de ladite face (14) de la plaquette (10) par collage.
6. Procédé selon l'une quelconque des revendications 2 à 5, caractérisé en ce qu'on forme une couche de rigidité en diamant avec une épaisseur de l'ordre de $1 \mu\text{m}$ et on effectue l'implantation d'ions avec une énergie E , telle que $E \geq 200 \text{ keV}$.
7. Procédé selon l'une quelconque des revendications 2 à 6, caractérisé en ce qu'on forme une couche de rigidité en carbure de silicium avec une épaisseur de l'ordre de $1,25 \mu\text{m}$ et on effectue l'implantation d'ions avec une énergie E telle que $E \geq 200 \text{ keV}$.
8. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce que le matériau de la plaquette est du silicium, respectivement du carbure de silicium, et en ce que la profondeur minimum est respectivement de $5 \mu\text{m}$ et de $1,15 \mu\text{m}$.





Office européen
des brevets

RAPPORT DE RECHERCHE EUROPEENNE

Numero de la demande
EP 96 40 1932

DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS			
Catégorie	Citation du document avec indication, en cas de besoin, des parties pertinentes	Revendication concernée	CLASSEMENT DE LA DEMANDE (Int.Cl.6)
A	EP-A-0 533 551 (COMMISARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE) * revendications 1,2 * -----	1	H01L21/20
			DOMAINES TECHNIQUES RECHERCHES (Int.Cl.6)
			H01L
Le présent rapport a été établi pour toutes les revendications			
Lieu de la recherche LA HAYE		Date d'achèvement de la recherche 29 Octobre 1996	Examinateur Vancraeynest, F
<p>CATEGORIE DES DOCUMENTS CITES</p> <p>X : particulièrement pertinent à lui seul Y : particulièrement pertinent en combinaison avec un autre document de la même catégorie A : arrière-plan technologique O : divulgation non-écrite P : document intercalaire</p> <p>T : théorie ou principe à la base de l'invention E : document de brevet antérieur, mais publié à la date de dépôt ou après cette date D : cité dans la demande I : cité pour d'autres raisons & : membre de la même famille, document correspondant</p>			

EPO FORM 150 01/87 (P/M CO)